News Release



報道機関各位

No.JE11-EP-24010

2024 年 8 月 30 日 株式会社ジーダット

ジーダット、仏 POLLEN METROLOGY 社と国内販売代理契約を締結

株式会社ジーダット(本社:東京都中央区、代表取締役社長:松尾和利、以下「ジーダット」)は、半導体製造の市場投入までの時間短縮する総合的な AI 駆動型プロセス制御プラットフォーム(以下「Smart3」)を提供する POLLEN METROLOGY(以下「POLLEN」)と販売代理店契約を締結しました。この提携により、ジーダットは国内における半導体製造分野のお客様に対して、POLLEN の Smart3 を提供することで、開発および製造プロセスに関連する複雑なデータの分析を自動化することができ新しい半導体プロセスの市場投入までの時間短縮を実現できるようになります。

POLLEN は 2014 年にフランスで設立、計測と検査の画像ベースのデータ分析に重点を置いた Smart3 を 10 年以上開発、米国、アジア、ヨーロッパの優良顧客に事業を展開し微細な画像解析による歩留まり低下の根本原因の特定を加速しています。

POLLEN の特長は画像解析に特化した技術で SEM (走査電子顕微鏡)、TEM (透過電子顕微鏡))、光学顕微鏡、STEM(走査透過電子顕微鏡)、音響顕微鏡などの画像データから対象物を高精度なセグメンテーション、計測、分析ツール、教師ありおよび教師なしの欠陥検出ツールにてプロセス設計の高速化、生産歩留まりの最適化、プロセス・計測・検査ハードウェアの ROI の向上を行うことができます。

POLLEN の分野は、自社 FAB を有する半導体企業では比較的内製ツールのシェアが多い 分野でもありますが省力化などでメンテナンスの継続等が難しくなってきております。 POLLEN はインフラ部分を担うことが可能なソフトウェア開発キットも用意しております。

今後、ジーダットと POLLEN は、密接に連携し、日本市場の動向を注視し、さらなるソリューションの拡充に向けて、共同で取り組んでまいります。



ジーダットの代表取締役社長である松尾和利は、次のように述べています。

「弊社は、POLLEN の革新的で高品質な製品を提供することで、日本の半導体製造分野において、高付加価値を提供できることを嬉しく思っています。このパートナーシップにより、お客様に豊富な選択肢と効率的なソリューションを提供できると期待しています。」

POLLEN の President & CEO である Johann Foucher 氏は、以下のように述べています。「ジーダットとの協力により、POLLEN の製品が日本の半導体製造分野で広がり、お客様にとってより生産性の高いプロセスが実現することを期待しています。ジーダットの経験豊富なチームとの連携を通じ、より多くのプロジェクトで成功を収めることができることを確信しています。」

【会社概要】

株式会社ジーダット https://www.jedat.co.jp/

■設立: 2004年

■事業内容: 半導体やディスプレイ設計向け設計自動化ソフトウェアの開発・販売・サ

ポート、および半導体設計受託業務

■所在地: 〒104-0043 東京都中央区湊 1-1-12 HSB 鐵砲洲

■代表者: 代表取締役社長 松尾 和利

POLLEN METROLOGY https://www.pollen-metrology.com/

■設立: 2014年

■事業内容: 半導体製造の市場投入までの時間短縮する総合的な AI 駆動型プロセス制

御プラットフォームを提供。計測と検査の画像ベースのデータ分析に重点 を置いた画像解析ツールを提供、フランスに拠点を置き、米国、アジア、

ヨーロッパの優良顧客に事業を展開。

■所在地: 122 rue du Rocher de Lorzier,38430 Moirans, France

■代表者: President & CEO Johann Foucher

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ジーダット 三浦一広

E メール: miura.kazuhiro @jedat.co.jp

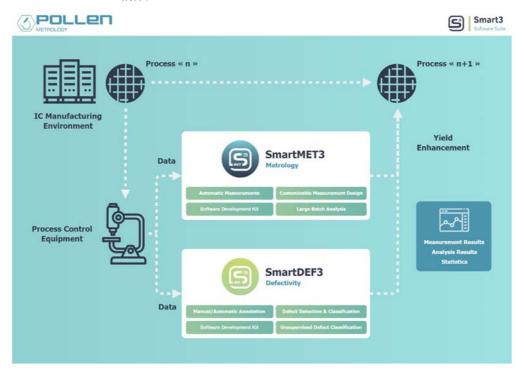
電話:03-6262-8400(代)

以上



【補足資料】

POLLEN Smart3 構成



POLLEN 土な製品ラインナップ

■SmartMET3

SmartMET3 を使用すると、製造された材料のすべての重要な寸法を抽出するために、人工知能から数回のクリックで画像処理監視モデルを作成できます。 SmartMET3 ソフトウェア プラットフォームは、SEM、TEM、STEM、光学、音響、AFM(…) などのさまざまな顕微鏡からの画像と互換性があります。

SmartMET3 は、生産サイクルへの実装と、以前に作成された計測モデルまたは社内の自作アルゴリズムの完全な自動化を可能にするために、API (アプリケーション プログラミングインターフェイス) と SDK (ソフトウェア開発キット) とともに提供されます。

■SmartDEF3

欠陥データの分析を自動化することで、製造プロセスの歩留まりを向上させます。

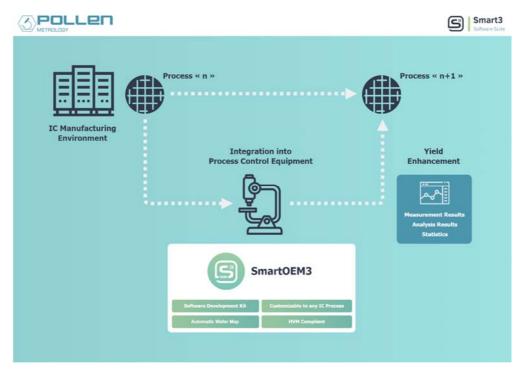
SmartDEF3 を使用すると、製造した材料の欠陥を検出、分類、測定するために、数回のクリックで教師ありまたは教師なしの人工知能モデルを作成できます。 SmartDEF3 ソフトウェア プラットフォームは、SEM、TEM、STEM、光学、音響、AFM などのさまざまな顕微鏡の画像と互換性があります。 分析は、パターン レベルまたはウェーハ レベルで実行



できます。

SmartDEF3 には、API (アプリケーション プログラミング インターフェイス) と SDK (ソフトウェア開発キット) が付属しており、生産サイクルでの実装と、以前に作成した欠陥モデルまたは社内のカスタム アルゴリズムの完全な自動化が可能です。

■SmartOEM3



SmartMET3 または SmartDEF3 のいずれかの Smart3 テクノロジーをあらゆるタイプの 顕微鏡に統合すると、計測/検査ハードウェアの ROI (投資収益率) が向上し、精度、柔軟性、 拡張性が向上してプロセス機能が拡張されます。

SmartOEM3 を使用すると、あらゆるタイプの顕微鏡ハードウェア (SEM、TEM、STEM、光学、音響、AFM など) に組み込むことができる AI 駆動型プロセス制御ソフトウェアを 3 か月未満で作成できます。ハードウェア サプライヤーは、社内アルゴリズム ライブラリを活用しながら、Smart3 ソフトウェア フレームワークに基づく独自の社内ソフトウェア を作成することで、社内開発に要する数年を節約できます。

SmartOEM3 は、API (アプリケーション プログラミング インターフェイス) と SDK (ソフトウェア開発キット) とともに提供されるため、生産サイクルでの実装と、以前に作成された計測モデルまたは社内の自家製顧客アルゴリズムの完全な自動化が可能になります

以上



Jedat signs Distribution Agreement with Pollen Metrology

Jedat Inc. (Head office: Chuo-ku, Tokyo, President and CEO: Kazutoshi Matsuo, hereinafter "Jedat") has signed a distributorship agreement with POLLEN METROLOGY (hereinafter "POLLEN"), which provides a comprehensive Al-driven process control platform (hereinafter "Smart3") that shortens the time to market for semiconductor manufacturing. Through this partnership, Jedat will be able to provide POLLEN's Smart3 to customers in the semiconductor manufacturing field in Japan, automating the analysis of complex data related to development and manufacturing processes, thereby shortening the time to market for new semiconductor processes.

POLLEN was founded in France in 2014 and has been developing Smart3 for over 10 years, focusing on image-based data analysis for metrology and inspection, and is expanding its business to blue-chip customers in the United States, Asia, and Europe, accelerating the identification of the root cause of yield loss through fine image analysis.

POLLEN's speciality is its image analysis technology, which allows high-precision segmentation of objects from image data such as SEM (scanning electron microscope), TEM (transmission electron microscope), optical microscope, STEM (scanning transmission electron microscope), and acoustic microscope, measurement, analysis tools, and supervised and unsupervised defect detection tools to speed up process design, optimize production yield, and improve the ROI of process, measurement, and inspection hardware.

POLLEN's field is one in which semiconductor companies with their own fabs have a relatively high share of in-house tools, but it is becoming difficult to continue maintenance due to labor-saving measures. POLLEN also offers a software development kit that can handle the infrastructure part.

In the future, Jedat and POLLEN will work closely together, closely monitor trends in the Japanese market, and work together to further expand their solutions.





Kazutoshi Matsuo, President and CEO of Jedat, commented:

"We are pleased to be able to offer POLLEN innovative, high quality products to create high added value to semiconductor manufacturing field in Japan. Through this partnership, we hope to provide our customers with a wide range of choices and efficient solutions."

Johann Foucher, President & CEO of POLLEN, commented:

"We look forward to working with Jedat to expand POLLEN products in the Japanese semiconductor manufacturing field and enable more productive processes for our customers. I am confident that the project will be successful."

[Company Profile]

Jedat Inc. https://www.jedat.co.jp/

■Established: 2004

■Business details: Development, sales, and support of design automation software for semiconductor and display design, and semiconductor design.

■Location: HSB Teppouzu, 1-1-12 Minato, Chuo-ku, Tokyo 104-0043

■Representative: Kazutoshi Matsuo, President and CEO

POLLEN METROLOGY https://www.pollen-metrology.com/

■Established: 2014

■Business details: Provides a comprehensive Al-driven process control platform that shortens time to market for semiconductor manufacturing. Providing image analysis tools with a focus on image-based data analysis for measurement and inspection, the company is based in France and operates with blue-chip customers in the US, Asia and Europe.

■Address: 122 rue du Rocher de Lorzier, 38430 Moirans, France

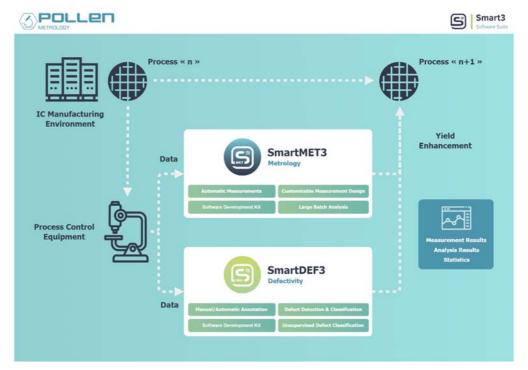
■Representative: Johann Foucher, President and CEO

[Contact information regarding this matter] Jedat Inc.

Email: miura.kazuhiro @jedat.co.jp Phone: +81-3-6262-8400 (Main)



Appendix: Product Structure



■SmartMET3

Accelerate the development of your manufacturing processes by automating the processing of images from any type of microscopes.

SmartMET3 makes it possible to create in a few clicks image processing supervised models from artificial intelligence in order to extract all the critical dimensions of the manufactured materials. The SmartMET3 software platform is compatible with images from various microscopes: SEM, TEM, STEM, Optical, Acoustic, AFM (...).

SmartMET3 is delivered with its API (Application Programming Interface) and its SDK (Software Development Kit) in order to allow its implementation in a production cycle and the complete automation of previously created metrology models or internal homemade customers algorithms.

■SmartDEF3

Enhance the yields of your manufacturing processes by automating the analysis of your defectivity data.

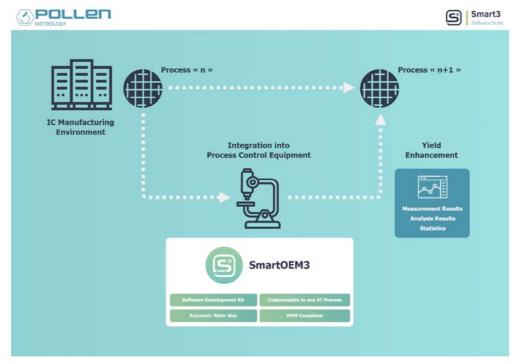
SmartDEF3 allows you to create supervised or unsupervised artificial intelligence models in a few clicks in order to detect, classify and measure defects in your manufactured materials. The SmartDEF3 software platform is compatible with images from various microscopes such as: SEM, TEM, STEM, Optics, Acoustics, AFM (...). The analysis can be done at the pattern



level or the wafer level.

SmartDEF3 is delivered with its API (Application Programming Interface) and its SDK (Software Development Kit) in order to allow its implementation in a production cycle and the complete automation of previously created defectivity models or internal homemade customers algorithms.

■SmartOEM3



■SmartOEM3

Integrate Smart3 technology either SmartMET3 and/or SmartDEF3 into any type of microscope to increase the ROI (Return on Investment) of the metrology/Inspection hardware and extend the process capabilities with higher accuracy, flexibility and scalability.

SmartOEM3 makes it possible to create in less than 3 months a Al-driven process control software that can be embedded into any type of microscope hardware (SEM, TEM, STEM, Optical, Acoustic, AFM (...). Hardware suppliers can save several years of internal development to create their own internal software based on Smart3 software framework while leveraging their internal algorithm library.

SmartOEM3 is delivered with its API (Application Programming Interface) and its SDK (Software Development Kit) in order to allow its implementation in a production cycle and the complete automation of previously created metrology models or internal homemade customers algorithms.